

電気学会 電気規格調査会標準規格  
**JEC-2390** : 2023 正誤票-1  
 開閉装置一般要求事項

発行日 : 2024 年 5 月 21 日

項番	ページ	箇所	誤	正																																																																																																																
7.2.6.2	35	表 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験 No.</th> <th>開閉装置の状態</th> <th>印加端子</th> <th>接地端子</th> <th>試験部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="3">対地及び異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>ABabF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>BCabcF</td> <td rowspan="5">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>ACabcF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>ABabcF</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>ABCbcF</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>開</td> <td>b</td> <td>ABCacF</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>開</td> <td>c</td> <td>ABCabF</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子	接地端子	試験部位	1	閉	Aa	BCbcF	対地及び異相主回路間	2	閉	Bb	ACacF	3	閉	Cc	ABabF	4	開	A	BCabcF	同相主回路端子間	5	開	B	ACabcF	6	開	C	ABabcF	7	開	A	ABCbcF	8	開	b	ABCacF	9	開	c	ABCabF		<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験 No.</th> <th>開閉装置の状態</th> <th>印加端子</th> <th>接地端子</th> <th>試験部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="3">対地及び異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>ABabF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>BCabcF</td> <td rowspan="5">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>ACabcF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>ABabcF</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>開</td> <td>a</td> <td>ABCbcF</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>開</td> <td>b</td> <td>ABCacF</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>開</td> <td>c</td> <td>ABCabF</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子	接地端子	試験部位	1	閉	Aa	BCbcF	対地及び異相主回路間	2	閉	Bb	ACacF	3	閉	Cc	ABabF	4	開	A	BCabcF	同相主回路端子間	5	開	B	ACabcF	6	開	C	ABabcF	7	開	a	ABCbcF	8	開	b	ABCacF	9	開	c	ABCabF																									
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子	接地端子	試験部位																																																																																																																
1	閉	Aa	BCbcF	対地及び異相主回路間																																																																																																																
2	閉	Bb	ACacF																																																																																																																	
3	閉	Cc	ABabF																																																																																																																	
4	開	A	BCabcF	同相主回路端子間																																																																																																																
5	開	B	ACabcF																																																																																																																	
6	開	C	ABabcF																																																																																																																	
7	開	A	ABCbcF																																																																																																																	
8	開	b	ABCacF																																																																																																																	
9	開	c	ABCabF																																																																																																																	
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子	接地端子	試験部位																																																																																																																
1	閉	Aa	BCbcF	対地及び異相主回路間																																																																																																																
2	閉	Bb	ACacF																																																																																																																	
3	閉	Cc	ABabF																																																																																																																	
4	開	A	BCabcF	同相主回路端子間																																																																																																																
5	開	B	ACabcF																																																																																																																	
6	開	C	ABabcF																																																																																																																	
7	開	a	ABCbcF																																																																																																																	
8	開	b	ABCacF																																																																																																																	
9	開	c	ABCabF																																																																																																																	
7.2.6.3	36	表 16	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試験 No.</th> <th rowspan="2">開閉装置の状態</th> <th colspan="2">印加端子</th> <th rowspan="2">接地端子</th> <th rowspan="2">試験部位</th> </tr> <tr> <th>電源1</th> <th>電源2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>BCbc</td> <td>F</td> <td rowspan="3">異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>ACac</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>ABab</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="3">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>c</td> <td>ABabF</td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位	電源1	電源2	1	閉	Aa	BCbc	F	異相主回路間	2	閉	Bb	ACac	F	3	閉	Cc	ABab	F	4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間	5	開	B	b	ACacF	6	開	C	c	ABabF	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試験 No.</th> <th rowspan="2">開閉装置の状態</th> <th colspan="2">印加端子</th> <th rowspan="2">接地端子</th> <th rowspan="2">試験部位</th> </tr> <tr> <th>電源1</th> <th>電源2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>BCbc</td> <td>F</td> <td rowspan="3">対地及び異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>ACac</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>ABab</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="3">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>c</td> <td>ABabF</td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位	電源1	電源2	1	閉	Aa	BCbc	F	対地及び異相主回路間	2	閉	Bb	ACac	F	3	閉	Cc	ABab	F	4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間	5	開	B	b	ACacF	6	開	C	c	ABabF																																
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子				接地端子	試験部位																																																																																																													
		電源1	電源2																																																																																																																	
1	閉	Aa	BCbc	F	異相主回路間																																																																																																															
2	閉	Bb	ACac	F																																																																																																																
3	閉	Cc	ABab	F																																																																																																																
4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間																																																																																																															
5	開	B	b	ACacF																																																																																																																
6	開	C	c	ABabF																																																																																																																
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位																																																																																																															
		電源1	電源2																																																																																																																	
1	閉	Aa	BCbc	F	対地及び異相主回路間																																																																																																															
2	閉	Bb	ACac	F																																																																																																																
3	閉	Cc	ABab	F																																																																																																																
4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間																																																																																																															
5	開	B	b	ACacF																																																																																																																
6	開	C	c	ABabF																																																																																																																
7.2.6.3	36	表 17	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試験 No.</th> <th rowspan="2">開閉装置の状態</th> <th colspan="2">印加端子</th> <th rowspan="2">接地端子</th> <th rowspan="2">試験部位</th> </tr> <tr> <th>雷インパルス</th> <th>補充電圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>Bb</td> <td>CcF</td> <td rowspan="3">異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>Aa (Cc)</td> <td>CcF (AaF)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>Bb</td> <td>AaF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="5">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>c</td> <td>ABabF</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>開</td> <td>a</td> <td>A</td> <td>BCbcF</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>開</td> <td>b</td> <td>B</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>開</td> <td>c</td> <td>C</td> <td>ABabF</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位	雷インパルス	補充電圧	1	閉	Aa	Bb	CcF	異相主回路間	2	閉	Bb	Aa (Cc)	CcF (AaF)	3	閉	Cc	Bb	AaF	4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間	5	開	B	b	ACacF	6	開	C	c	ABabF	7	開	a	A	BCbcF	8	開	b	B	ACacF	9	開	c	C	ABabF		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試験 No.</th> <th rowspan="2">開閉装置の状態</th> <th colspan="2">印加端子</th> <th rowspan="2">接地端子</th> <th rowspan="2">試験部位</th> </tr> <tr> <th>雷インパルス</th> <th>補充電圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>閉</td> <td>Aa</td> <td>Bb</td> <td>CcF</td> <td rowspan="3">対地及び異相主回路間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>閉</td> <td>Bb</td> <td>Aa (Cc)</td> <td>CcF (AaF)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉</td> <td>Cc</td> <td>Bb</td> <td>AaF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>開</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>BCbcF</td> <td rowspan="5">同相主回路端子間</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>開</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>開</td> <td>C</td> <td>c</td> <td>ABabF</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>開</td> <td>a</td> <td>A</td> <td>BCbcF</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>開</td> <td>b</td> <td>B</td> <td>ACacF</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>開</td> <td>c</td> <td>C</td> <td>ABabF</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位	雷インパルス	補充電圧	1	閉	Aa	Bb	CcF	対地及び異相主回路間	2	閉	Bb	Aa (Cc)	CcF (AaF)	3	閉	Cc	Bb	AaF	4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間	5	開	B	b	ACacF	6	開	C	c	ABabF	7	開	a	A	BCbcF	8	開	b	B	ACacF	9	開	c	C	ABabF	
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子				接地端子	試験部位																																																																																																													
		雷インパルス	補充電圧																																																																																																																	
1	閉	Aa	Bb	CcF	異相主回路間																																																																																																															
2	閉	Bb	Aa (Cc)	CcF (AaF)																																																																																																																
3	閉	Cc	Bb	AaF																																																																																																																
4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間																																																																																																															
5	開	B	b	ACacF																																																																																																																
6	開	C	c	ABabF																																																																																																																
7	開	a	A	BCbcF																																																																																																																
8	開	b	B	ACacF																																																																																																																
9	開	c	C	ABabF																																																																																																																
試験 No.	開閉装置の状態	印加端子		接地端子	試験部位																																																																																																															
		雷インパルス	補充電圧																																																																																																																	
1	閉	Aa	Bb	CcF	対地及び異相主回路間																																																																																																															
2	閉	Bb	Aa (Cc)	CcF (AaF)																																																																																																																
3	閉	Cc	Bb	AaF																																																																																																																
4	開	A	a	BCbcF	同相主回路端子間																																																																																																															
5	開	B	b	ACacF																																																																																																																
6	開	C	c	ABabF																																																																																																																
7	開	a	A	BCbcF																																																																																																																
8	開	b	B	ACacF																																																																																																																
9	開	c	C	ABabF																																																																																																																
10.10.2	63	2 行目	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 の 8.3.3.3 及び JIS C 8201-5-1 の 8.3.3.3 による。	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 : 2020 の 8.3.3.3 及び JIS C 8201-5-1 : 2010 の 8.3.3.3 による。																																																																																																																
10.10.3	64	2 行目	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 の 8.3.4.3 及び JIS C 8201-5-1 の 8.3.4 による。	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 : 2020 の 8.3.4.3 及び JIS C																																																																																																																

				8201-5-1 : 2010 の 8.3.4 による。												
10.10.4	64	2行目	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 の 8.3.3.5 及び JIS C 8201-5-1 の 8.3.3.5 による。	検証方法及び合格基準は、JIS C 8201-1 : 2020 の 8.3.3.5 及び JIS C 8201-5-1 : 2010 の 8.3.3.5 による。												
附属書 I 1.1	77	1行目	表 I.1 は制御、操作及び補助回路の構成部品に関する参照規格の一覧である。IEC 62271-1 においては、・・・	表 I.1 は制御、操作及び補助回路の構成部品に関する参照規格の一覧である。IEC 62271-1 : 2017 においては、・・・												
解説 3.1 h)	88	16行目 他	<p>なお、これまでの許容ガス漏れ量に対する規定の背景は次のとおりである。SF<sub>6</sub>ガスの地球温暖化への影響が問題となり、…(中略)…この実績から、JEAC 5001 : 2017 においても「SF<sub>6</sub>ガス絶縁機器からのSF<sub>6</sub>ガス自然漏洩は漏洩率 0.1 vol%/年で算定する」と規定されている。諸外国においてもガス漏れ量の管理方法について IEC や CIGRE で検討がなされ、IEC 517 の改正版である IEC 62271-203 : 2022 では、許容ガス漏れ量が形式試験 0.5 vol%/年以下と規定されている。…(中略)…JEAC-2390 : 2023 では、電気協同研究での調査結果よりこれまでに実績のあるシール構造、試験方法において、JEAC 5001-2017 が規定する漏洩率 0.1 vol%/年を十分に満たす実力が確認されているものの、IEC 62271-203 : 2022 と整合をとって構造規定及び形式試験の許容ガス漏れ量を 0.5 vol%/年以下に改正している。なお、ルーチン・現地試験については、その目的が個別の製造状態を効率的に確認することであり、IEC 62271-203 : 2022 におけるルーチン・現地試験の規定も 1 vol%/年又は 3 vol%/年以下であることから、現行どおり許容ガス漏れ量を 1 vol%/年以下としている。</p>	<p>なお、これまでの許容ガス漏れ量に対する規定の背景は次のとおりである。SF<sub>6</sub>ガスの地球温暖化への影響が問題となり、…(中略)…この実績から、JEAC 5001 : 2000 においても「SF<sub>6</sub>ガス絶縁機器からのSF<sub>6</sub>ガス自然漏洩は漏洩率 0.1 vol%/年で算定する」と規定されている。諸外国においてもガス漏れ量の管理方法について IEC や CIGRE で検討がなされ、IEC 517 の改正版である IEC 62271-203 : 2003 では、許容ガス漏れ量が形式試験 0.5 vol%/年以下と規定されている。…(中略)…JEAC-2390 : 2023 では、電気協同研究での調査結果よりこれまでに実績のあるシール構造、試験方法において、JEAC 5001-2000 が規定する漏洩率 0.1 vol%/年を十分に満たす実力が確認されているものの、IEC 62271-203 : 2003 と整合をとって構造規定及び形式試験の許容ガス漏れ量を 0.5 vol%/年以下に改正している。なお、ルーチン・現地試験については、その目的が個別の製造状態を効率的に確認することであり、IEC 62271-203 : 2003 におけるルーチン・現地試験の規定も 1 vol%/年又は 3 vol%/年以下であることから、現行どおり許容ガス漏れ量を 1 vol%/年以下としている。</p>												
解説 5	97	解説表 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>この規格の内容</th> <th>IEC 62271-1 : 2017 の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.4.6.1 一般</td> <td>           温度上昇限度表内の温度上昇限度値。            銅接触(非酸化性ガス中 85 K)            銀接触(非酸化性ガス中 85 K)            油機器の規定を削除            ポリマーがい管部分を追加         </td> <td>           温度上昇限度表内の温度上昇限度値。            銅接触(非酸化性ガス中 75 K)            銀接触(非酸化性ガス中 75 K)         </td> </tr> </tbody> </table>	項目	この規格の内容	IEC 62271-1 : 2017 の内容	7.4.6.1 一般	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 銅接触(非酸化性ガス中 85 K) 銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 油機器の規定を削除 ポリマーがい管部分を追加	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 銅接触(非酸化性ガス中 75 K) 銀接触(非酸化性ガス中 75 K)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>この規格の内容</th> <th>IEC 62271-1 : 2017 の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.4.6.1 一般</td> <td>           温度上昇限度表内の温度上昇限度値。            接触部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K)            導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K)            油機器の規定を削除            ポリマーがい管部分を追加         </td> <td>           温度上昇限度表内の温度上昇限度値。            接触部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K)            導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K)         </td> </tr> </tbody> </table>	項目	この規格の内容	IEC 62271-1 : 2017 の内容	7.4.6.1 一般	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 接触部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 油機器の規定を削除 ポリマーがい管部分を追加	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 接触部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K) 導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K)
項目	この規格の内容	IEC 62271-1 : 2017 の内容														
7.4.6.1 一般	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 銅接触(非酸化性ガス中 85 K) 銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 油機器の規定を削除 ポリマーがい管部分を追加	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 銅接触(非酸化性ガス中 75 K) 銀接触(非酸化性ガス中 75 K)														
項目	この規格の内容	IEC 62271-1 : 2017 の内容														
7.4.6.1 一般	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 接触部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 85 K) 油機器の規定を削除 ポリマーがい管部分を追加	温度上昇限度表内の温度上昇限度値。 接触部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K) 導体接続部・銀接触(非酸化性ガス中 75 K)														